

Nanoanalytik in der Praxis: Nano- und Mikrobereichsanalyse von Oberflächen und Materialien

Veranstaltung - Nanoanalytik in der Praxis: Nano- und Mikrobereichsanalyse von Oberflächen und Materialien

Titel	Nanoanalytik in der Praxis: Nano- und Mikrobereichsanalyse von Oberflächen und Materialien
Wann	Di, 10. November 2009 - Mi, 11. November 2009

Beschreibung

Nanoanalytik in der Praxis: Nano- und Mikrobereichsanalyse von Oberflächen und Materialien

Das Portfolio der analytischen Techniken und die Nanometer-Dimension werden kontinuierlich erweitert und erschlossen. Hier erfahren Sie alles über neuere nano- und oberflächenanalytische Methoden:

Analytische Techniken

- Rasterelektronenmikroskopie (REM)
- Photoelektronenmikroskopie (XPS, ESCA)
- Rasterkraftmikroskopie (AFM, SXM)
- Sekundärionenmassenspektrometrie ((ToF-)SIMS)
- Ionenstreuungsspektroskopie (ISS, LEIS)

Anwendungsbereiche

- Produktentwicklung
- Produktions- und Qualitätskontrolle
- Fehleranalytik

Weitere Details zur Veranstaltung bekommen Sie [HIER](#)



Lokalität - Regensburg

Standort	Regensburg
-----------------	----------------------------

Ortsname
Land

Regensburg
DE